

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60352-4

1994

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2000-07

Amendement 1

Connexions sans soudure –

Partie 4:

**Connexions autodénudantes, non accessibles
sans soudure – Règles générales,
méthodes d'essai et guide pratique**

[IEC 60352-4:1994/AMD1:2000](https://standards.itec.ch/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

<https://standards.itec.ch/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000>

Amendment 1

Solderless connections –

Part 4:

**Solderless non-accessible insulation
displacement connections –
General requirements, test methods and
practical guidance**

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

R

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/908/FDIS	48B/937/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

Page 2

SOMMAIRE

[IEC 60352-4:1994/AMD1:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-60352-4/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-60352-4/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

Remplacer Section 4 et les articles 14 à 18 par ce qui suit: [amd1-2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-60352-4/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

SECTION 4 – GUIDE PRATIQUE

- 14 Généralités
- 15 Informations sur les outils
- 16 Informations sur les contacts
- 17 Informations sur les fils
- 18 Informations sur les connexions
- 19 Connexions CAD, visibles dans le boîtier
- 20 Connexions CAD, cachées dans le boîtier
- 21 Informations générales complémentaires sur les connexions CAD des connecteurs multicontacts
- 22 Remarques finales

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on Voting
48B/908/FDIS	48B/937/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Report on Voting in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2003. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Page 3

CONTENTS

[IEC 60352-4:1994/AMD1:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

Replace Section 4 and clauses 14 to 18 by the following:

SECTION 4 – PRACTICAL GUIDANCE

- 14 General
- 15 Tool information
- 16 Termination information
- 17 Wire information
- 18 Connection information
- 19 ID connections, open housing design
- 20 ID connections, closed housing design
- 21 General additional information about ID connections as part of a multi-pole connector
- 22 Final remarks

Page 8

INTRODUCTION

Ajouter le nouveau texte suivant après la figure 1:

Le guide 109 de la CEI met en évidence le besoin de réduire l'incidence d'un produit sur l'environnement naturel tout au long du cycle de vie du produit.

Il est entendu que quelques-unes des matières autorisées dans cette norme peuvent avoir un effet négatif sur l'environnement.

Dès que les progrès technologiques conduiront à des alternatives acceptables pour ces matières, celles-ci seront éliminées de la présente norme.

Page 10

3 Références normatives

Ajouter les nouvelles références suivantes:

Guide 109 de la CEI:1995, *Aspects liés à l'environnement – Prise en compte dans les normes électrotechniques de produit*

CEI 60512-11-7:1996, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques – Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 11: Essais climatiques – Section 7: Essai 11g: Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz*

Page 42

12.4.3 Corrosion en atmosphère industrielle

Remplacer le titre et le texte de ce paragraphe par ce qui suit:

12.4.3 Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz

L'essai doit être effectué conformément à l'essai 11g de la CEI 60512-11-7.

Sauf indication contraire dans la spécification particulière, les critères suivants doivent être appliqués:

Méthode: 1

Durée de l'exposition: 10 jours

NOTE Cette méthode est un essai de mélange de deux gaz.

H₂S: 100 ± 20 (10⁻⁹ vol/vol)

SO₂: 500 ± 100 (10⁻⁹ vol/vol)

Page 9

INTRODUCTION

Add, after Figure 1, the following new text:

IEC Guide 109 advocates the need to minimise the impact of a product on the natural environment throughout the product life cycle.

It is understood that some of the materials permitted in this standard may have a negative environmental impact.

As technological advances lead to acceptable alternatives for these materials, they will be eliminated from the standard.

Page 11

3 Normative references

Add the following new references:

IEC Guide 109:1995, *Environmental aspects – Inclusion in electrotechnical product standards*

IEC 60512-11-7:1996, *Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing procedures and measuring methods – Part 11: Climatic tests – Section 7: Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test*

[IEC 60352-4:1994/AMD1:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000>

Page 43

12.4.3 Corrosion, industrial atmosphere

Replace the title and the text of this subclause by the following:

12.4.3 Flowing mixed gas, corrosion test

The test shall be carried out in accordance with test 11g of IEC 60512-11-7.

Unless otherwise specified by the detail specification, the following details shall apply:

Method: 1

Duration of exposure: 10 days

NOTE This test is a method with two mixed gases.

H₂S: 100 ± 20 (10⁻⁹ vol/vol)

SO₂: 500 ± 100 (10⁻⁹ vol/vol)

Remplacer le tableau 3 existant par le nouveau tableau 3 suivant:

Tableau 3 – Nombre de spécimens requis

Programme d'essais	Paragraphes	Connexions non réutilisables			Connexions réutilisables		
		Pour un diamètre de fil seulement	Pour une gamme de diamètres de fils		Pour un diamètre de fil seulement	Pour une gamme de diamètres de fils	
			Maximum	Minimum		Maximum	Minimum
Programme d'essais de base 13.2	13.2.2.1	20 et 2 (optionnel) ^a	20 et 2 (optionnel) ^a	20 et 2 (optionnel) ^a	20 et 2 (optionnel) ^a	20 et 2 (optionnel) ^a	
	13.2.2.2			2 ^b et 2 (optionnel) ^c	2 ^b et 2 (optionnel) ^c		
Programme d'essais complet 13.3	13.3.2.1.1	2 (optionnel) ^a	2 (optionnel) ^a	2 (optionnel) ^a	2 (optionnel) ^a	2 (optionnel) ^a	
	13.3.2.1.2	20	20	20	20	20	
	13.3.2.1.3	20	20	20	20	20	
	13.3.2.1.4	20	20	20	20	20	
	13.3.2.2				40 ^b et 2 (optionnel) ^c	40 ^b et 2 (optionnel) ^c	
^a pour microsection ^b pour recâblage des connexions (avec le même contact, voir 12.2.3) ^c pour recâblage des connexions (avec le même contact, voir 12.2.3) et microsection							

ITeH STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)

13.2.2.1 Essai des connexions CAD non accessibles des contacts réutilisables ou non réutilisables

IEC 60352-4:1994/AMD1:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c->

Remplacer la première phrase par ce qui suit: <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c->

Pour essayer les connexions CAD non réutilisables, il est requis 20 spécimens et 2 spécimens (optionnel), et en complément, si les contacts qui admettent une gamme de diamètres de fils doivent être essayés, 20 spécimens et 2 spécimens (optionnel).

13.2.2.2 Essais complémentaires des connexions CAD non accessibles des contacts réutilisables

Remplacer la première ligne par ce qui suit:

Pour essayer les connexions CAD réutilisables, il est requis en complément 2 spécimens et 2 spécimens (optionnel).

Page 47

Replace the existing table 3 by the following new table 3:

Table 3 – Number of specimens required

Test schedule	Subclause	Non-reusable terminations			Reusable terminations		
		For one wire diameter only	For a range of wire diameters		For one wire diameter only	For a range of wire diameters	
			Maximum	Minimum		Maximum	Minimum
Basic test schedule 13.2	13.2.2.1	20 and 2 (optional) ^a	20 and 2 (optional) ^a	20 and 2 (optional) ^a	20 and 2 (optional) ^a	20 and 2 (optional) ^a	20 and 2 (optional) ^a
	13.2.2.2				2 ^b and 2 (optional) ^c	2 ^b and 2 (optional) ^c	
Full test schedule 13.3	13.3.2.1.1	2 (optional) ^a	2 (optional) ^a	2 (optional) ^a	2 (optional) ^a	2 (optional) ^a	2 (optional) ^a
	13.3.2.1.2	20	20	20	20	20	20
	13.3.2.1.3	20	20	20	20	20	20
	13.3.2.1.4	20	20	20	20	20	20
	13.3.2.2				40 ^b and 2 (optional) ^c	40 ^b and 2 (optional) ^c	

^a for microsection
^b for repeated connection (with the same termination, see 12.2.3)
^c for repeated connection (with the same termination, see 12.2.3) and microsection

ITeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

13.2.2.1 Testing of non-accessible ID connections with reusable or non-reusable terminations

Replace the first sentence by the following:

For testing non-reusable ID terminations, 20 specimens and 2 specimens (optional) are required, and additionally, if terminations suitable for a range of wire diameters are to be tested, 20 specimens and 2 specimens (optional).

Page 49

13.2.2.2 Additional testing of non-accessible ID connections with reusable terminations

Replace the first line by the following:

For testing reusable ID terminations additionally 2 specimens and 2 specimens (optional) are required.

Page 50

13.3.2.1 Essai des connexions CAD non accessibles des contacts réutilisables ou non réutilisables

Remplacer la première phrase par ce qui suit:

Pour essayer les connexions CAD non réutilisables, il est requis 60 spécimens et 2 spécimens (optionnel), et en complément, si les contacts qui admettent une gamme de diamètres de fils doivent être essayés, 60 spécimens et 2 spécimens (optionnel).

Page 56

13.3.2.2 Essai complémentaire des connexions CAD non accessibles des contacts réutilisables

Remplacer la première ligne par ce qui suit:

Pour essayer les connexions CAD réutilisables, il est requis en complément 40 spécimens et 2 spécimens (optionnel).

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60352-4:1994/AMD1:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000>

Page 51

13.3.2.1 Testing of non-accessible ID connections with reusable or non-reusable terminations

Replace the first sentence by the following:

For testing non-reusable ID terminations, 60 specimens and 2 specimens optional are required, and additionally, if terminations suitable for a range of wire diameters are to be tested, 60 specimens and 2 specimens (optional).

Page 57

13.3.2.2 Additional testing of non-accessible ID-connections with reusable terminations

Replace the first line by the following:

For testing reusable ID terminations additionally 40 specimens and 2 specimens (optional) are required.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60352-4:1994/AMD1:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1c25fa56-3753-4a23-af9c-ee9c27273723/iec-60352-4-1994-amd1-2000>

Remplacer la figure 11 existante par la nouvelle figure 11 suivante:

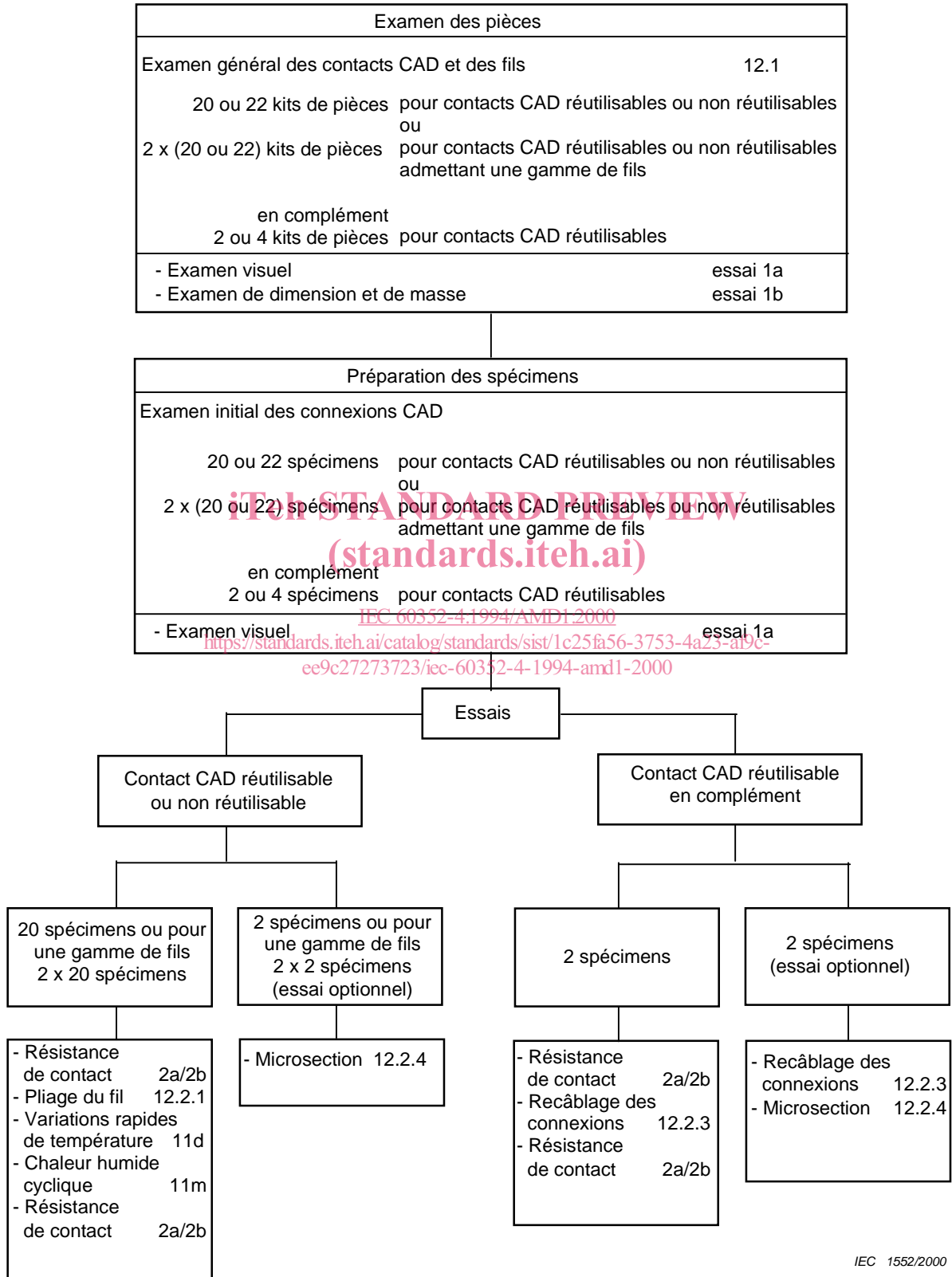


Figure 11 – Programme d'essais de base (voir 13.2)

Replace the existing figure 11 by the following new figure 11:

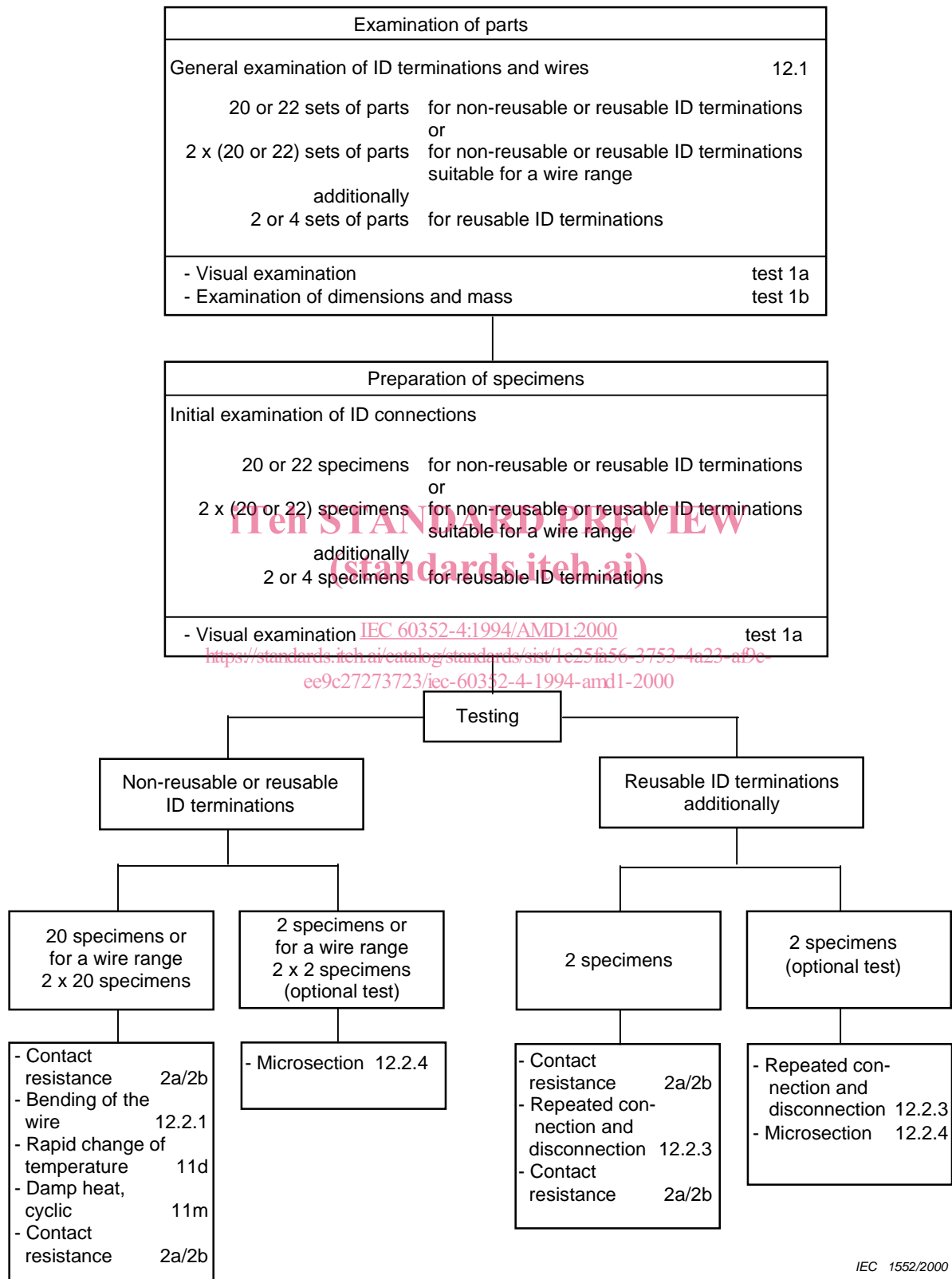
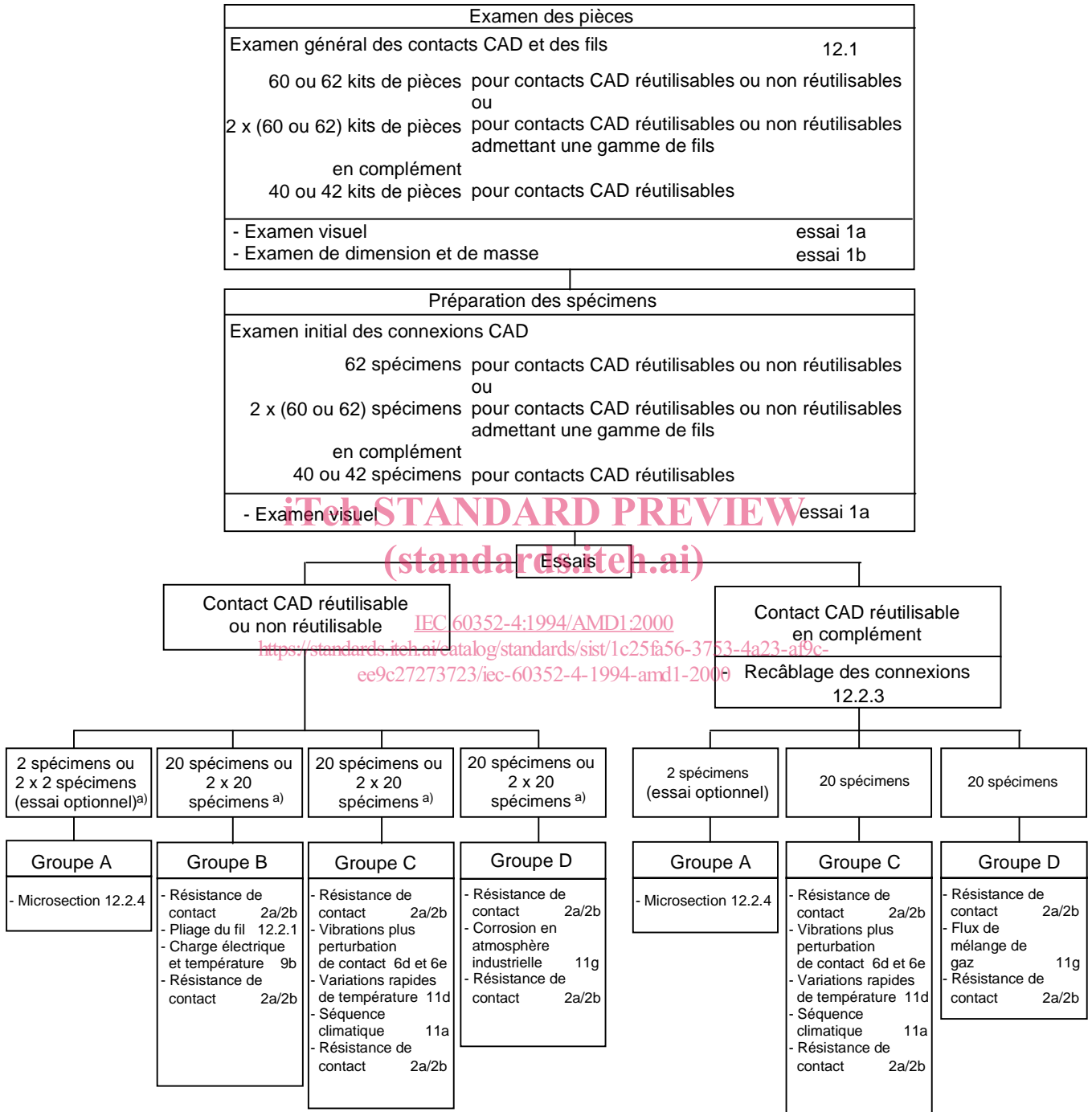


Figure 11 – Basic test schedule (see 13.2)

Remplacer la figure 12 existante par la nouvelle figure 12 suivante:



^{a)} Deux fois le nombre de spécimens pour une gamme de fils

Figure 12 – Programme d’essais complet (voir 13.3)